

ных сигналов модуля. Так, если предварительно записать в ОЗУ одного из каналов в четные адреса логическую «1», а в нечетные — логический «0» и подать на вход F сигналы частотой 1 МГц, то на выходном разъеме соответствующем выходу

Формат данных при команде чтения

W8		R1
----	--	----

Содержимое ячейки памяти 8-го канала Содержимое ячейки памяти 1-го канала

- $A(0)F(16)$ — перезапись счетчика адреса ОЗУ (ПЗУ);
 $A(0)F(17)$ — перезапись данных в ОЗУ по адресу, соответствующему содержимому счетчика адреса, добавление «1» к этому содержимому.

Формат данных при команде перезаписи

W8		W1
----	--	----

Данные для ОЗУ
8-го канала Данные для ОЗУ
1-го канала

- $A(0)F(25)$ — пуск считывания содержимого ОЗУ (ПЗУ);
 $A(i)F(16)$ — перезапись содержимого ОЗУ i -го канала по адресу, соответствующему содержимому счетчика адреса ($i=1, \dots, 8$);
 $A(i)F(17)$ — перезапись содержимого ОЗУ i -го канала по адресу, соответствующему содержимому счетчика адреса, добавление «1» к этому содержимому ($i=1, \dots, 8$).

Модуль предназначен для систем автоматизации физических экспериментов и АСУ ТП.

Авторы выражают благодарность С. В. Бредихину и В. С. Якушеву за полезные обсуждения.

Поступило в редакцию 26 марта 1981 г.

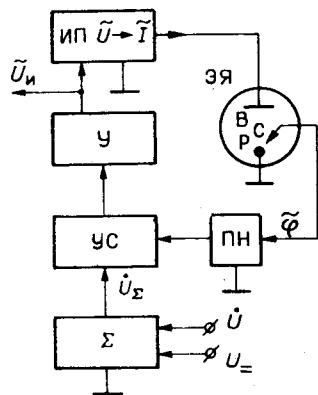
УДК 621.317.73

В. И. КЕНЗИН, С. П. НОВИЦКИЙ
(Новосибирск)

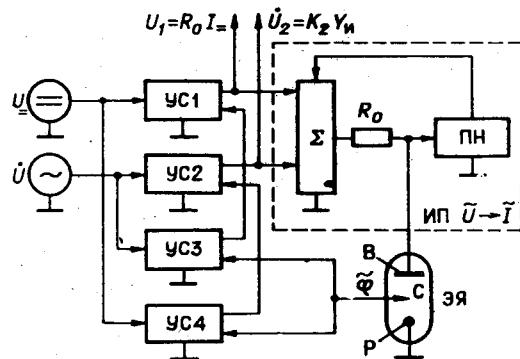
**АВТОКОМПЕНСАЦИОННЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОВОДИМОСТЬ — НАПРЯЖЕНИЕ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ТРЕБУЕМУЮ ПОЛЯРИЗАЦИЮ
ИССЛЕДУЕМОГО ОБЪЕКТА**

Изучение термодинамических и физико-химических свойств различных объектов, например биологических и электрохимических, требует проведения быстрого автоматического измерения параметров комплексных величин в области низких и инфракрасных частот при автоматическом поддержании нужного измерительного режима объекта по постоянному току [1]. Такие измерения сравнительно нетрудно выполнить на основе автокомпенсационных электроизмерительных цепей уравновешивания, теоретические основы и вопросы практической реализации которых изложены в ряде монографий (см., например, [2, 3]). Эти устройства имеют высокое быстродействие и точность измерения. Важнейшим узлом таких устройств, определяющим в конечном итоге точность измерения, является измерительный преобразователь комплексной величины (ИПКВ) в активный сигнал (напряжение или ток). Отличительная особенность ИПКВ для биологических и электрохимических объектов — наличие в его составе цепи поляризации объекта по постоянному току.

Известные автокомпенсационные ИПКВ [4] для развязки цепи преобразования комплексной величины и цепи задания требуемого измерительного режима по постоянному току используют разделительные цепи и фильтры; в области инфракрасных



Puc. 1.



Puc. 2.

частот такие ИПКВ не могут обеспечить быстрого преобразования (в течение одного-двух периодов измеряемого сигнала). Это побудило авторов данной статьи создать новые автокомпенсационные ИПКВ, которые работали бы на инфразвуковых частотах с заданием необходимого измерительного режима объекта по постоянному току. Предложенные нами ИПКВ обеспечивают получение требуемого комплекса информативных параметров и могут быть непосредственно включены в состав автоматизированных (на основе ЭВМ) систем для научных электрохимических и биологических исследований.

Структурная схема простейшего ИПКВ с одним контуром автоматического регулирования, отвечающего указанным выше требованиям, приведена на рис. 1. Объектом исследований является электрохимическая ячейка (ЭЯ) с электролитом, в который погружены рабочий (Р), сравнивающий (С) и вспомогательный (В) электроды. Преобразование измеряемой комплексной проводимости Y между Р- и С-электродами в напряжение \dot{U}_i и поддержание разности потенциалов между ними φ_{\perp} равной напряжению поляризации U — выполняются следующим образом. Переменное напряжение \dot{U} и постоянное поляризующее напряжение U_{\perp} , изменяющееся по требуемой для эксперимента программе, суммируются в сумматоре Σ , на выходе которого напряжение

$$\hat{U}_2 = \hat{U} + U_{\infty}. \quad (1)$$

Оно поступает на один из входов устройства сравнения (УС), на второй вход которого через повторитель напряжения (ПН) подается разность потенциалов φ между Р- и С-электродами, равная

$$\tilde{\varphi} = \varphi_0 + \dot{\varphi}, \quad (2)$$

φ_0 — и φ — постоянная и переменная составляющие разности потенциалов $\tilde{\varphi}$. При этом напряжение разбаланса, выделенное устройством сравнения (УС) и усиленное усилителем (У), с учетом (1) и (2) можно представить в виде

$$U_a = K_y (\tilde{\Phi} - \hat{U}_x) = U_{a+} + U_{a-} \quad (3)$$

K_U — коэффициент передачи усилителя напряжения U , $U_{in} = K_U(\varphi - U_{in})$ и $\dot{U}_{in} = K_U(\dot{\varphi} - \dot{U})$ — постоянная и переменная составляющие напряжения U_{in} . Измерительный преобразователь (ИП) $\dot{U} \rightarrow I$ формирует из напряжения U_{in} ток I , протекающий через электрохимическую ячейку, но не зависящий от ее проводимости, равный

$$\tilde{I} = K_{\text{ИП}} \tilde{U}_i = K_{\text{ИП}} U_{i=+} + K_{\text{ИП}} U_{i=-} = I_+ + I_- \quad (4)$$

где $K_{\text{ИП}}$ — коэффициент передачи ИП $\tilde{U} \rightarrow \tilde{I}$, $I = K_{\text{ИП}} U_{\text{и}}$ и $\dot{I} = K_{\text{ИП}} \dot{U}_{\text{и}}$ — постоянная и переменная составляющие тока электрохимической ячейки.

Из уравнения (4) видно, что значение постоянной составляющей тока ячейки $I_{\text{п}} =$ (тока поляризации) при известном Кип можно отсчитать непосредственно по значению постоянной составляющей $U_{\text{п}} =$ напряжения $\bar{U}_{\text{п}}$.

Выражение для искомой комплексной проводимости участка Р — С электроды, как следует из рис. 1, может быть записано в форме

$$Y_u = i/\dot{\phi} = K_{\text{imp}} U_u / \dot{\phi}. \quad (5)$$

Пренебрегая погрешностью статизма контура автоматического регулирования, примем $\varphi = \dot{U}$. В этом случае уравнение (5) преобразуется к виду

$$X_u \equiv K_{uu} \dot{U}_u / \dot{U} \equiv K_u \dot{U}_u \quad (6)$$

Здесь $K_1 = K_{\text{ИП}}/\dot{U}$ — коэффициент преобразования (известная величина). Из уравнения (6) следует, что искомую комплексную проводимость участка Р—С электроды электрохимической ячейки можно непосредственно отсчитывать по значению переменной составляющей \dot{U} напряжения U_n .

Рассматриваемую структуру (см. рис. 1) целесообразно использовать при сравнимых значениях $|\phi|$ и $|\varphi|$. В этом случае будет иметь место примерно равная статистическая погрешность преобразования $Y_n \rightarrow \dot{U}$ и $I_n \rightarrow U_n$.

При проведении электрохимических исследований зачастую требуется, чтобы переменная составляющая напряжения на участке Р—С электроды не превышала по модулю единиц милливольт, в то время как диапазон регулирования φ_n имеет интервал от 0 до $\pm 2,5$ В.

В таких случаях использование простейшей структуры ИПКВ привело бы к различию статических погрешностей поддержания φ_n и $|\phi|$ на два-три порядка, и для решения задачи становится необходимым более совершенный ИПКВ [5], структурная схема которого приведена на рис. 2. Основные условные обозначения здесь такие же, как на рис. 1. Более подробно изображен измерительный преобразователь напряжения в ток ИП $\dot{U} \rightarrow I$ [6]. Он содержит сумматор Σ , образованный резистором R_0 и повторитель напряжения (ПН). В рассматриваемом ИПКВ проводится вначале сравнение напряжения поляризации U_n и гармонического напряжения \dot{U} в устройствах сравнения УС3 и УС4 с разностью потенциалов $\dot{\varphi} = \varphi - +\varphi$ между Р- и С-электродами. На выходах этих устройств формируются соответственно напряжения $U_3 = \varphi_n$ и $U_4 = \varphi$, которые поступают в устройства сравнения УС1 и УС2, где сопоставляются соответственно с напряжениями U_n и \dot{U} . Полученные разности напряжений усиливаются в блоках УС1 и УС2 и затем поступают в измерительный преобразователь ИП $\dot{U} \rightarrow I$, формирующий ток, равный

$$I = (U_1 + \dot{U}_2)/R_0 = I_n + \dot{I}, \quad (7)$$

где I/R_0 — коэффициент преобразования ИП $\dot{U} \rightarrow I$; U_1 и \dot{U}_2 — выходные напряжения устройств сравнения УС1 и УС2; $I_n = U_1/R_0$ и $\dot{I} = \dot{U}_2/R_0$ — постоянная и переменная составляющие тока I . Таким образом, ток I не зависит от проводимости ячейки и разности потенциалов φ_n на ее электродах (значение постоянной составляющей тока ячейки I_n может быть отсчитано по значению напряжения U_1).

Учитывая, что $|\varphi| \cong |\dot{U}|$, выражение для комплексной проводимости Y_n участка Р—С электроды можно записать в виде $Y_n = I/\dot{\varphi} \cong \dot{U}_2/R_0 \dot{U}$, откуда имеем $\dot{U}_2 = K_2 Y_n$, где $K_2 = R_0 \dot{U}$ — коэффициент преобразования.

Таким образом, комплексная проводимость Y_n может быть отсчитана непосредственно по значению выходного напряжения \dot{U}_2 .

Заметим, что рассмотренные структурные схемы ИПКВ пригодны и для преобразования комплексных параметров двухполюсных объектов. В этом случае при построении ИПКВ по структуре рис. 1 необходимо к выходу ИП $\dot{U} \rightarrow I$ подключить исследуемый двухполюсник и вход повторителя напряжения ПН, при построении ИПКВ по структуре рис. 2 — исследуемый двухполюсник и входы устройств сравнения УС3 и УС4.

На основе рассмотренных структурных схем, используя стандартную элементную базу, авторы разработали ряд измерительных преобразователей комплексных проводимостей в напряжение. Здесь мы охарактеризуем три модификации ИПКВ, наиболее пригодные для практического использования. Рассматриваемые преобразователи испытывались на моделях из RC-элементов в интервале температур 15—35°C. Общими характеристиками преобразователей являются диапазон комплексных проводимостей 10^{-1} — 10^{-6} См при $\operatorname{tg} \delta = 0,1$ — 10 и диапазон потенциостатирования $0 \div \pm 2,5$ В при изменении тока поляризации от $\pm 10^{-5}$ до $\pm 10^{-2}$ А.

Вначале охарактеризуем две модификации ИПКВ, изготовленные по схеме рис. 1. Первая из них, собранная на усилительных элементах типа К140УД1Б, имеет следующие характеристики: значение модуля относительной погрешности преобразования комплексной проводимости в напряжение $|\delta Y_n|$, вычисленное по методу, изложенному в [7], в полосе частот 10^{-3} — 10^4 Гц, не превышает 3%; статическая погрешность поддержания заданного напряжения ± 2 мВ; максимальная скорость нарастания напряжения при резистивной нагрузке 10 В/мс. Во второй модификации ИПКВ узлы УС и У (см. рис. 1) выполнены на микросхемах 701МЛ19, остальные узлы — на микросхемах К140УД1Б. Этот ИПКВ имеет погрешность преобразования $|\delta Y_n| \leq 0,1\%$ в полосе частот 10^{-3} — 10^3 Гц, статическую погрешность поддержания заданного напряжения $\pm 0,1$ мВ, максимальную скорость нарастания напряжения 0,1 В/мс; применение микросхем 701МЛ19 повышает отдельные метрологические характеристики преобразователя по сравнению с первой модификацией, но в некоторых случаях может ограничивать его использование, поскольку он имеет в два раза большие габариты и примерно в десять раз большую стоимость.

Хороший компромисс между стоимостью и техническими характеристиками, на наш взгляд, достигается в ИПКВ, реализованном по схеме рис. 2 на микросхемах К140УД1Б. В этом преобразователе сравнительно нетрудно удастся в полосе частот 10^{-3} — 10^4 Гц снизить погрешность преобразования до $|\delta Y_n| \leq 0,5\%$ и стати-

ческую погрешность поддержания заданного напряжения до ± 1 мВ и обеспечить максимальную скорость нарастания напряжения 1 В/мс.

Таким образом, на основе предложенных принципов построения ИПКВ оказалось возможным строить сравнительно несложные, достаточно точные (класса 0,1—0,5) и с умеренной стоимостью измерительные преобразователи комплексной проводимости в напряжение для двух- и трехполюсных объектов при одновременном поддержании между определенными полюсами объекта требуемого измерительного режима по постоянному току.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ахутин В. М. и др. Применение частотных методов для исследования физиологических объектов.— В кн.: Бионика и математическое моделирование в биологии: Семинар. Киев: изд. ИК АН УССР, 1966.
2. Карапеев К. Б. и др. Быстродействующие электронные компенсационно-мостовые приборы.— М.: Энергия, 1970.
3. Измерение комплексных проводимостей в физико-химическом эксперименте: Сб.
7. Гриневич Ф. Б. Автоматические мосты переменного тока.— Новосибирск: изд. РИО СО АН СССР, 1964, с. 12.

Поступило в редакцию 6 декабря 1978 г.;
окончательный вариант — 11 февраля 1981 г.

УДК 537.311.33.082.52

Б. С. ВАКАРОВ, И. С. ВАКАРОВА, В. И. ВИШНЯКОВ
(Одесса)

ФОТОПРИЕМНИК НА ОСНОВЕ БАРЬЕРА ШОТТКИ И ИЗОТИПНОГО ГЕТЕРОПЕРЕХОДА

В ряде работ [1—3] сообщается о фоточувствительных структурах, обладающих инверсией знака в спектре фототока и представляющих, таким образом, определенный интерес с точки зрения их использования в оптоэлектронных устройствах [4]. Указанная особенность фототока обусловлена разделением генерируемых светом носителей тока двумя расположеными на различной глубине слоями объемного заряда со встречно-направленными внутренними электрическими полями.

В настоящей работе приведены результаты исследования фотоэлектрических свойств структуры металл — $n^+Al_xGa_{1-x}As-nGaAs$, являющейся комбинацией барьера Шоттки (металл — $n^+Al_xGa_{1-x}As$) и гетероперехода ($n^+Al_xGa_{1-x}As-nGaAs$). Присутствие в данной структуре двух неэквивалентных областей пространственного заряда определяет форму кривой спектрального распределения фототока: в ней наблюдаются две точки, в которых фототок меняет знак.

Изотипные гетеропереходы $Al(GaAs)-GaAs$ создавались жидкофазным эпитаксиальным наращиванием на GaAs-подложку твердых растворов $Al_xGa_{1-x}As$ с различной величиной молярной доли алюминия ($0,2 < x < 0,7$). Эпигексиальные слои легировались теллуром, и толщина их после обработки поверхности для нанесения слоя металла составляла 20—30 мкм. Выращенные твердые растворы имели переменный состав в направлении, перпендикулярном поверхности слоя, их ширина запрещенной зоны убывала по мере удаления от границы раздела с градиентом около 0,01 эВ/мкм. Концентрация носителей в GaAs-подложке составляла величину $\sim 10^{16}$ см $^{-3}$, а уровень легирования эпигексиального слоя был заметно выше 10^{18} см $^{-3}$. Омический контакт к подложке осуществлялся вплавлением In [5], а барьер Шоттки — химическим осаждением [6] полупрозрачного слоя золота на обработанную стандартными методами поверхность твердого раствора.

Исследование фотоэлектрических свойств структуры проводилось методом синхронного детектирования в режиме тока короткого замыкания при нулевом смещении и при подаче смещения обеих полярностей. Освещение структуры осуществлялось со стороны твердого раствора.

Результаты измерений при ~ 300 К спектрального распределения фототока j_ϕ структур с различным значением параметра x показаны на рис. 1. В спектрах фоточувствительности содержится две точки инверсии знака фототока, причем для всех